所属専門分野	電子情報工学科(松下研究室)						
学籍番号	06232002	氏	名	和泉	辰矢		
論文題目	CVD 法による YGdBCO 線材の超伝導特性の超伝導層厚依存性						

<u>1. はじめに</u>

現在、YBCOコート線材は高い臨界電流密度特性を示すことから期待をされている。その中でも、製造コストが安価な IBAD/CVD 法が、実用化に向けた REBCOコート線材の作製法として注目を 集めている。そこで、我々は IBAD/CVD 法で作製した YBCOコート線材に対して超伝導特性評価を行ってきたが、初期の IBAD/CVD 法では IBAD/PLD 法と同様に、超伝導層を厚くするに 従って、超伝導層の結晶の乱れも大きくなり、そのために臨界電 流密度特性の劣化が著しかった[1]。一方、Yの一部を Gd に置換 することにより臨界温度が高くなることから、近年 YGdBCOコート線材の開発が進められており[2]、YBCOコート線材より高い臨 界電流密度特性を得られることが期待されている。

そこで本研究では、IBAD/CVD 法 YGdBCO コート線材について 作製時の原料の組成比を変化させるなどの工夫を行い、改めて臨 界電流密度特性に及ぼす超伝導層厚の影響を明らかにする。

2. 実験

試料は中部電力(株)で作製された超伝導層厚 d が 0.33~1.43 µm の 6 種類の IBAD/CVD 法 $Y_{0.7}Gd_{0.3}BCO$ コート線材で、それぞれ#1 ~#6 とした。試料の超伝導層の厚さ及び臨界温度 T_c を Table 1 に示す。SQUID 磁力計を用いて直流磁化を測定し、その結果から臨界電流密度 J_c を、磁化緩和測定から E-J特性及び見かけのピンポテンシャル U_0^* を評価した。なお、磁界はテープの広い面に対して垂直に加えた。

Table 1 Specification of specimens

Specimen	#1	#2	#3	#4	#5	#6	
<i>d</i> (μm)	0.33	0.55	0.77	0.99	1.21	1.43	
$T_{\rm c}$ (K)	89.3	89.6	90.9	91.3	90.7	89.7	

3. 結果と考察

Fig.1 に 0.1 T での各試料の J_c-d 特性を示す。超伝導層厚が厚く なるに従い J_cがやや増加していることが分かる。この傾向は温度 が高くなるにつれて強まっている。以前の IBAD/CVD 法 YBCO コ ート線材[1]の特性を比較して示すが、これと本試料とでは、依存 性が逆転している。これは YGdBCO コート線材の作製技術の向上 から厚膜化過程による超伝導組織の乱れを抑えることができたこ とと、超伝導層の厚い試料の方が磁束クリープの影響を受けにく いためと考えられる。

Fig. 2 に 77.3 K での各試料の *J_c-B* 特性を示す。超伝導層が薄く なるに従い、磁界 *B* の増加による *J_c* の減少率は大きくなる事が分 かる。これは高磁界下において、磁束線の長さ方向のピンニング 相関距離が超伝導層の厚さを超えてしまうことから、磁束バンド ルサイズが超伝導層の厚さで制限を受けて、磁束クリープの影響 を顕著に受けているためである。 20 K での磁化緩和特性から求めた U₀*の実験結果や磁 束クリープ・フローモデルを用いた解析、および詳細な議 論は当日行う。



Fig. 1 Thickness dependence of critical current density at 0.1 T. The lines show the results on YBCO tape [1].



Fig. 2 Critical current density vs magnetic field at 77.3 K.

参考文献

[1]高橋ら:第70回応用物理学会学術講演予稿集 9p-R-7 [2]A.Kaneko *et al.*, Physica C 426–431. 949–953(2005)